

産業標準案作成対象テーマの審議について

日本産業規格（JIS）の制定、改正又は廃止のための産業標準案（以下、JIS 案という。）の作成に着手するに当たっては、当会認定産業標準作成機関 JIS 案作成規程に基づき、当該 JIS 案作成対象テーマが適切であることについて、主務大臣による事前調査、及び JSA 事務局による“JIS 案の作成開始要件”を満たすことの事前確認を経て、産業標準作成委員会にお諮りすることとなっております。

つきましては、次ページ以降の JIS 案作成対象テーマについて、理由（必要性）及び期待効果、JIS 案の作成開始要件への適合状況、作成開始予定などを記載しておりますので、JIS 案の作成に着手してよろしいかご審議をお願いいたします。また、産業標準作成委員会の下に JIS 素案の調査審議及び作成を行うための WG を設置することについても併せてご審議をお願いいたします。

なお、字句等編集上の修正については、産業標準作成委員会事務局に一任いただきますようお願いいたします。また、ご承認いただいた JIS 案作成対象テーマは、利害関係者に公表するために JIS 作成予定一覧表として JSA ウェブサイト掲載いたします。

※選定基準 3（産業標準化の利点・欠点）各コードの内容につきましては、
下記リンク先の 5～6 ページにてご確認いただけます。

「産業標準案等審議・審査ガイドライン」

URL <https://www.jisc.go.jp/jis-act/pdf/shingishinsa-guideline.pdf>

産業標準案作成対象テーマ一覧(制定)

認定機関	産業標準作成委員会	制定/改正/廃止	規格番号(制定の場合は、仮の番号)	JIS案の名称	JIS案の英文名称	制定する理由(必要性)	期待効果	規定項目又は改正点	制定・改正に伴う廃止JIS	対応する国際規格番号及び名称	対応する国際規格との対応の程度	測定基準1(JIS法第2条の産業標準化の対象)	測定基準2(JIS法第1条の法律の目的)	測定基準3(産業標準化の利点・欠点)	測定基準4(国が主体的に取り組む分野の判断基準)	測定基準5(市場適合性に関する判断基準)	JIS素案作成委員会(WG)	作成開始予定
JSA	06 電子	制定	C5954-8	光伝送用能動部品－試験及び測定方法－第8部：発光素子及び受光素子	Fiber optic active components and devices – Test and measurement procedures – Part 8: Photoemitters and photoreceivers	光伝送用能動部品の測定方法について、JISでは、IEC 60747-5:1992 (Semiconductor devices, Discrete devices and integrated circuits – Part 5: Optoelectronic devices) から対応する部品の測定方法を包含した、JIS C 5941 (光伝送用半導体レーザー測定方法)、JIS C 5945 (光伝送用半導体レーザーモジュール測定方法)、JIS C 5951 (光伝送用発光ダイオード測定方法)及びJIS C 5991 (光伝送用フォトダイオード測定方法)が対応しており、部品種別ごとに異なるJISとなっている。 一方、IECでは1997年にIEC 60747-5から光伝送用に特化した測定方法を抽出してIEC 62007-2 (Semiconductor optoelectronic devices for fibre optic system applications – Part 2: Measuring methods 1997年制定 2009年改訂)を再編し、基本特性の測定方法はIEC 60747-5に残された。その後、IEC 60747-5から各部品の基本特性測定方法を包含したIEC規格として、半導体レーザー(モジュールを含む)のIEC 60747-5-4 (Semiconductor devices – Part 5-4: Optoelectronic devices – Semiconductor lasers 2006年制定 2022年改訂)、発光ダイオードのIEC 60747-5-6 (Semiconductor devices – Part 5-6: Optoelectronic devices – Light emitting diodes 2016年制定 2021年改訂)、フォトダイオードのIEC 60747-5-7 (Semiconductor devices – Part 5-7: Optoelectronic devices – Photodiodes and phototransistors 2016年制定)を再編した。 このように、IEC規格とJISとの対応関係に不整合が生じているとともに、IECではそれぞれの部品の測定方法について、IEC 60747-5シリーズに規定されている基本特性測定方法とIEC 62007-2に規定されている測定方法を共に参照する必要があり不便であった。 よって、規格利用者の不整合による混乱を避けるとともに1つの規格とすることで利便性を向上させるために、現行規格JIS C 5941、JIS C 5945、JIS C 5951及びJIS C 5991を包含し、現行IEC規格と整合した光伝送用半導体部品の測定方法を新たにJIS C 5954-8として制定する。なお、これに伴い、重複するJIS C 5941、JIS C 5945、JIS C 5951及びJIS C 5991は廃止する。	この規格を制定することによって、 a) 製品の効率的な開発・製造が可能となり、かつ、取引の円滑化も期待できる。 b) 製造者や利用者間における製品の相互接続性の確保に寄与することで、市場の拡大が期待できる。	主な規定項目は、次のとおり。 ・適用範囲 ・引用規格 ・用語及び定義 ・発光素子測定方法 ・受光素子測定方法	C5941: IEC 60747-5-4: 2022, 1997, C5945: 2005, C5951: 1997, C5991: 1997	IEC 60747-5-4: 2022, Semiconductor devices – Part 5-4: Optoelectronic devices – Semiconductor lasers IEC 60747-5-6: 2021, Semiconductor devices – Part 5-6: Optoelectronic devices – Light emitting diodes IEC 60747-5-7: 1997, Semiconductor devices – Part 5-7: Optoelectronic devices – Photodiodes and phototransistors IEC 62007-2: 2009, Semiconductor optoelectronic devices for fibre optic system applications – Part 2: Measuring methods	MOD	第2条の該当号: 4(測定方法) 対象事項: 光伝送用能動部品	法律の目的に適合している。	利点: ア, オ 欠点: いずれも該当しない。	–	国際規格をJIS化するもの	一般財団法人光産業技術振興協会のWG	2024年4月
JSA	06 電子	制定	C5955-4	光伝送用能動部品－性能標準テンプレート－第4部：光伝送用半導体レーザー及び半導体レーザーモジュール	Fiber optic active components and devices – Performance standard template – Part 4: Laser diodes and laser modules for fiber optic transmission	光伝送用半導体レーザー関連の性能標準テンプレートに関する規格として、JISでは光伝送用半導体レーザーに関してはJIS C5940(光伝送用半導体レーザー通則)が、光伝送用半導体レーザーモジュールに関してはJIS C5944(光伝送用半導体レーザーモジュール通則)が制定されている。対応国際規格は、半導体レーザーについてはIEC60747-5 (Semiconductor devices, Discrete devices and integrated circuits – Part 5: Optoelectronic devices: 1992年制定, 1995年修正2発行)であり、半導体レーザーモジュールについてはIEC62007-1 (Semiconductor optoelectronic devices for fibre optic system applications – Part 1: Specification template for essential ratings and characteristics: 1997年制定, 2015年改訂)である。なおIEC60747-5の一部として包含されていた半導体レーザーについては、2006年にIEC60747-5-4 (Semiconductor devices – Part 5-4: Optoelectronic devices – Semiconductor lasers: 2006年制定, 2022年改訂)に移行している。JIS C5940及びJIS C5944では定格及び性能に加え環境試験及び耐久性試験についても項目が規定されており、さらに規定値として記述すべき数値の範囲や性能の試験条件として与えるべき数値の範囲が規定 (JIS C5940) 又は推奨値として示され (JIS C5944) している。しかし、IEC60747-5-4及びIEC62007-1のいずれもJISとは異なり、定格及び性能については規定すべき事項だけを規定し、個々の数値については規定せず、環境試験及び耐久性試験については規定が無い。これは光伝送用部品に関するIEC規格が、応用により個々に規定すべき性能標準が異なることから、部品ごとの性能標準テンプレートは最小限の共通事項のみを規定し、環境試験及び耐久性試験も応用ごとに異なるので個々の応用に対応した性能標準テンプレート又は性能標準で規定するという体系に変わってきたことによるものである。このようにIEC規格とJISとの対応関係に不整合が生じているので、混乱を避けるために新たにIEC規格と整合した性能標準テンプレートの制定が必要である。また、半導体レーザーと半導体レーザーモジュールは共通事項が多いことから、1つの規格とすることで規格利用者の利便性を向上を図るため、JIS C5940及びJIS C5944の両規格の内容を包含しIEC規格と整合した性能標準テンプレートとすることとし、JIS C5955規格群(性能標準テンプレート)における新たな規格 (JIS C5955-4)として制定する。なお、これに伴い重複するJIS C5940及びJIS C5944を廃止する。	この規格を制定することによって、 a) 製品の効率的な開発・製造が可能となり、かつ、取引の円滑化も期待できる。 b) 製造者や利用者間における製品の相互接続性の確保に寄与することで、市場の拡大が期待できる。	主な規定項目は、次のとおり。 ・適用範囲 ・引用規格 ・用語及び定義 ・形状及び分類 ・パッケージ情報 ・レーザー構造及び半導体材料 ・絶対最大定格規定 ・電気的及び光学的性能規定項目 ・附属性能説明項目	C5940: 1997, C5944: 2005	IEC 60747-5-4: 2022, Semiconductor devices – Part 5-4: Optoelectronic devices – Semiconductor lasers IEC 62007-1: 2015, Semiconductor optoelectronic devices for fibre optic system applications – Part 1: Specification template for essential ratings and characteristics	MOD	第2条の該当号: 1(性能) 対象事項: 光伝送用能動部品	法律の目的に適合している。	利点: ア, ウ, オ 欠点: いずれも該当しない。	–	国際規格をJIS化するもの	一般財団法人光産業技術振興協会のWG	2024年4月

産業標準案作成対象テーマ一覧(制定)

認定機関	産業標準作成委員会	制定/改正/廃止	規格番号(制定の場合は、仮の番号)	JIS案の名称	JIS案の英文名称	制定する理由(必要性)	期待効果	規定項目又は改正点	制定・改正に伴う廃止JIS	対応する国際規格番号及び名称	対応する国際規格との対応の程度	選定基準1 (JIS法第2条の産業標準化の対象)	選定基準2 (JIS法第1条の法律の目的)	選定基準3 (産業標準化の利点・欠点)	選定基準4 (国が主体的に取り組む分野の判断基準)	選定基準5 (市場適合性に関する判断基準)	JIS素案作成委員会(WG)	作成開始予定
JSA	06 電子	制定	C5955-5	光伝送用能動部品－性能標準テンプレート－第5部:光伝送用発光ダイオード	Fiber optic active components and devices – Performance standard template – Part 5: Light emitting diodes for fiber optic transmission	光伝送用発光ダイオードの性能標準テンプレートに関する規格として、JISではJIS C 5950(光伝送用発光ダイオード通則)が制定されている。対応国際規格はIEC 60747-5:1992+AMD1:1994(Semiconductor devices, Discrete devices and integrated circuits – Part 5: Optoelectronic devices)である。IEC規格ではIEC 62007-1(Semiconductor optoelectronic devices for fibre optic system applications – Part 1:Specification template for essential ratings and characteristics)が光伝送用に特化した光伝送用半導体部品性能標準テンプレートとして1997年に制定(2015年修正版発行)されており、この中に光伝送用発光ダイオードも含まれている。 JIS C 5950では定格及び性能に加え環境試験及び耐久性試験についても項目が規定されており、さらに規定値として記述すべき数値の範囲や性能の試験条件として与えるべき数値の範囲も規定されている。IEC 62007-1ではJIS C 5950とは異なり、基本性能及び特性について規定すべき事項だけを規定し、個々の数値については規定せず環境試験及び耐久性試験については規定が無い。これは光伝送用部品に関するIEC規格が、応用により個々に規定すべき性能標準が異なることから、部品ごとの性能標準テンプレートは最小限の共通事項のみを規定する、及び環境試験及び耐久性試験も応用ごとに異なるので個々の応用に対応した性能標準テンプレート又は性能標準で規定するという体系に変わってきたことによるものである。 このようにIEC規格とJISとの対応関係に不整合が生じているので、混乱を避けるために新たにIEC規格と整合した性能標準テンプレートの制定が必要である。JISでは光伝送用能動部品の性能標準テンプレートはJIS C 5955規格群で構成されていることから、IEC 62007-1と整合した光伝送用発光ダイオードの性能標準テンプレートを新たにJIS C 5955規格群(性能標準テンプレート)におけるJIS C 5955-5として制定する。なお、これに伴い重複するJIS C 5950を廃止する。	この規格を制定することによって、 a) 製品の効率的な開発・製造が可能となり、かつ、取引の円滑化も期待できる。 b) 製造者や利用者間における製品の相互接続性の確保に寄与することで、市場の拡大が期待できる。	主な規定項目は、次のとおり。 ・適用範囲 ・引用規格 ・用語及び定義 ・構造及び半導体材料 ・パッケージ情報 ・絶対最大定格規定 ・電気的及び光学的性能規定項目 ・附属性能説明項目	C5950:1997	IEC 62007-1: 2015, Semiconductor optoelectronic devices for fibre optic system applications – Part 1: Specification template for essential ratings and characteristics	MOD	第2条の該当号: 1(性能) 対象事項: 光伝送用能動部品	法律の目的に適合している。	利点: ア, ウ, オ 欠点: いずれも該当しない。	—	国際規格をJIS化するもの	一般財団法人光産業技術振興協会のWG	2024年4月
JSA	06 電子	制定	C5955-6	光伝送用能動部品－性能標準テンプレート－第6部:光伝送用フォトダイオード	Fiber optic active components and devices – Performance standard templates – Part 6: Photodiodes for fiber optic transmission	光伝送用フォトダイオードの性能標準テンプレートに関する規格として、JISではJIS C 5990(光伝送用フォトダイオード通則)が制定されている。対応国際規格はIEC 60747-5:1992+AMD1:1994(Semiconductor devices, Discrete devices and integrated circuits – Part 5: Optoelectronic devices)である。IEC規格では、IEC 62007-1(Semiconductor optoelectronic devices for fibre optic system applications – Part 1:Specification template for essential ratings and characteristics)が光伝送用に特化した光伝送用半導体部品性能標準テンプレートとして1997年に制定(2015年修正版発行)されており、この中に光伝送用フォトダイオードも含まれている。 JIS C 5990では定格及び性能に加え環境試験及び耐久性試験についても項目が規定されており、さらに規定値として記述すべき数値の範囲や性能の試験条件として与えるべき数値の範囲も規定されている。IEC 62007-1ではJIS C 5990とは異なり、基本性能及び特性について規定すべき事項だけを規定し、個々の数値については規定せず、環境試験及び耐久性試験については規定が無い。これは光伝送用部品に関するIEC規格が、応用により個々に規定すべき性能標準が異なることから、部品ごとの性能標準テンプレートは最小限の共通事項のみを規定する、及び環境試験及び耐久性試験も応用ごとに異なるので個々の応用に対応した性能標準テンプレート又は性能標準で規定するという体系に変わってきたことによるものである。 このようにIEC規格とJISとの対応関係に不整合が生じているので、混乱を避けるために新たにIEC規格と整合した性能標準テンプレートの制定が必要である。JISでは光伝送用能動部品の性能標準テンプレートはJIS C 5955規格群で構成されていることから、IEC 62007-1と整合した光伝送用フォトダイオードの性能標準テンプレートを新たにJIS C 5955規格群(性能標準テンプレート)におけるJIS C 5955-6として制定する。なお、これに伴い重複するJIS C 5990を廃止する。	この規格を制定することによって、 a) 製品の効率的な開発・製造が可能となり、かつ、取引の円滑化も期待できる。 b) 製造者や利用者間における製品の相互接続性の確保に寄与することで、市場の拡大が期待できる。	主な規定項目は、次のとおり。 ・適用範囲 ・引用規格 ・用語及び定義 ・パッケージ形状分類 ・レーザ構造及び半導体材料 ・絶対最大定格規定 ・定格規定及び特性規定項目 ・電気的及び光学的性能規定項目 ・附属性能説明項目	C5990:1997	IEC 62007-1: 2015, Semiconductor optoelectronic devices for fibre optic system applications – Part 1: Specification template for essential ratings and characteristics	MOD	第2条の該当号: 1(性能) 対象事項: 光伝送用能動部品	法律の目的に適合している。	利点: ア, ウ, オ 欠点: いずれも該当しない。	—	国際規格をJIS化するもの	一般財団法人光産業技術振興協会のWG	2024年4月

産業標準案作成対象テーマ一覧(制定)

認定機関	産業標準作成委員会	制定/改正/廃止	規格番号 (制定の場合は、仮の番号)	JIS案の名称	JIS案の英文名称	制定する理由(必要性)	期待効果	規定項目又は改正点	制定・改正に伴う廃止JIS	対応する国際規格番号及び名称	対応する国際規格との対応の程度	選定基準1 (JIS法第2条の産業標準化の対象)	選定基準2 (JIS法第1条の法律の目的)	選定基準3 (産業標準化の利点・欠点)	選定基準4 (国が主体的に取り組む分野の判断基準)	選定基準5 (市場適合性に関する判断基準)	JIS素案作成委員会(WG)	作成開始予定
JSA	06 電子	制定	C61757-2-2	光ファイバセンサー第2-2部: 温度測定-分布型センシング	Fiber optic sensors - Part 2-2: Temperature measurement - Distributed sensing	光ファイバセンサーは、国内市場への普及を鑑みると仕様や評価方法の統一が必要であると判断され、2022年にJIS C 61757(光ファイバセンサー通則)が制定された。 一方、多種多様な光ファイバセンサーのうち、特に多く利用されている分布型温度センサーの詳細な仕様及び評価方法を個別規格として統一すべきとの要望が出されている。このような状況から、市場の状況を踏まえ、分布型光ファイバ温度センサーの仕様並びに試験及び測定方法について、IEC61757-2-2:2016を基に、JISを制定する必要がある。	この規格を制定することによって、光ファイバセンサーの製品の開発・製造が容易になり、かつ、取引の円滑化も期待される。また、国際規格と整合することにより市場の拡大が期待される。	主な規定項目は次のとおり。 ・適用範囲 ・引用規格 ・用語及び定義 ・性能パラメータの測定のための一般試験系 ・性能パラメータの測定方法	—	IEC61757-2-2:2016 Fibre optic sensors - Part 2-2: Temperature measurement - Distributed sensing	IDT	第2条の該当号: 4(試験方法、測定方法) 対象事項: 分布型光ファイバ温度センサー	法律の目的に適合している。	利点: ア、ウ、エ、オ、ク、コ 欠点: いずれも該当しない。	—	国際標準をJIS化するもの	一般財団法人光産業技術振興協会のWG	2024年4月

産業標準案作成対象テーマ一覧(改正)

認定機関	産業標準作成委員会	制定/改正/廃止	規格番号	JIS案の名称	JIS案の英文名称	改正する理由(必要性)	期待効果	規定項目又は改正点	制定・改正に伴う廃止JIS	対応する国際規格番号及び名称	対応する国際規格との対応の程度	選定基準1 (JIS法第2条の産業標準化の対象)	選定基準2 (JIS法第1条の法律の目的)	選定基準3 (産業標準化の利点・欠点)	選定基準4 (国が主体的に取り組む分野の判断基準)	選定基準5 (市場適合性に関する判断基準)	JIS素案作成委員会(WG)	作成開始予定
JSA	06 電子	改正	C5916-3	光ファイバ形分散補償器	Fiber optic chromatic dispersion compensator using single-mode dispersion compensating fiber	この規格は、シングルモード光ファイバを用いた光伝送において屋内環境条件で使用するシングルモード分散補償光ファイバを用いた受動波長分散補償器(以下、光ファイバ形分散補償器という。)の定格、光学特性並びに環境及び耐久性特性について規定したもので、IEC 61753-141-2:2011を基に2013年に制定したものである。 光ファイバ通信システムは、情報化社会を支えるインフラとして必要不可欠なものであり、その長延化のために使用する光ファイバ形分散補償器は、ICT社会のさらなる発展に伴い、今後も多量導入が予想されている。光ファイバ形分散補償器の個別規格としては、2011年に第1版として発行されたIEC 61753-141-2の光ファイバ形分散補償器の個別規格は特に改訂はされていないが、環境及び耐久性特性の試験方法で基にしている規格の更新に伴い、試験条件の規定内容と技術的な差異が生じている。具体的には、耐環境性及び耐久性特性の試験項目として、現行規格には「光ファイバクランプ強度(ねじり)試験」がないために追加の必要がある。また、耐環境性及び耐久性特性の試験項目〔耐寒性、耐熱性、光ファイバクランプ強度(繰返し曲げ)、光ファイバクランプ強度(軸方向引張り)及び光ファイバクランプ強度(横方向引張り)〕において、それぞれの試験の基としている規格とにおいて、挿入損失の試験条件に差異が生じている。このような状況から、これら技術的差異を解消し、技術の実態に即した内容とするために、JISを改正する必要がある。	国内の通信事業者が使用している光ファイバ通信システム用の光部品と同様の使用環境に対応した光ファイバ形分散補償器の調達容易となり、調達コストの削減、システムの拡張や災害・保守時の追加調達が迅速に行え、情報通信ネットワークの安定かつ発展的な運用が期待できる。	主な改正点は次のとおり。 ・環境及び耐久性特性において、使用の実態に即して「光ファイバクランプ強度(ねじり)試験」の規定を追加する。 ・環境及び耐久性特性において、耐熱性及び耐熱性の試験条件の挿入損失及び波長分散について、より適切な結果を得るため、試験前後の測定に加えて「試験中に、1h以下の間隔で測定する。」旨を追加する。 ・環境及び耐久性特性において、光ファイバクランプ強度の軸方向引張り、横方向引張り及び繰返し曲げの試験条件の挿入損失及び波長分散について、試験前後の測定に加えて「試験中及び試験前後に測定する。」旨を追加する。	—	IEC 61753-141-2:2011, Fibre optic interconnecting devices and passive components – Performance standard – Part 141-2: Fibre optic passive chromatic dispersion compensator using single-mode dispersion compensating fibre for category C – Controlled environments	MOD	第2条の該当号: 1(性能) 対象事項: 光ファイバ形分散補償器	法律の目的に適合している。	利点: ア、イ、ウ、エ、オ、キ 欠点: いずれも該当しない。	—	国際標準をJIS化するもの	一般財団法人光産業技術振興協会のWG	2024年4月
JSA	06 電子	改正	C5952-12	光伝送用能動部品パッケージ及びインタフェース標準-第12部:同軸形高周波コネクタ付半導体レーザ送信モジュール	Fiber optic active components and devices – Package and interface standards – Part 12: Laser transmitters with a coaxial RF connector	この規格は、高速光伝送装置に用いられる同軸形高周波コネクタ付半導体レーザ送信モジュールの物理的インタフェースの互換性を確立することを目的として、その仕様について規定したものである。対応国際規格IEC 62148-12 (Laser transmitters with a coaxial RF connector)が、Amendment1を取り込むためにEd. 1.0:2004からEd. 1.1:2022に改訂され、体系見直しによる引用規格(IEC 60169-15からIEC 61169-15へ)の入替え及び対象とする同軸形高周波コネクタ付半導体レーザ送信モジュールのデバイス分類上の区分変更(タイプ5からタイプ7へ)があった。国内においても、国際規格との整合性を図るとともに、技術の実態に即して改正する必要があることから、このJISを改正する必要がある。	この規格を改定することによって、 a) 製品の効率的な開発・製造が可能となり、かつ、取引の円滑化も期待できる。 b) 製造者や利用者間における製品の相互接続性の確保に寄与することで、市場の拡大が期待できる。	主な改正点は、次のとおり。 ・電氣的インタフェースの同軸コネクタにおいて、引用しているIEC 60169-15を、国際規格との整合のためIEC 61169-15に改める。 ・分類において、同軸形高周波コネクタ付半導体レーザ送信モジュールがタイプ1からタイプ6のいずれにも当てはまらないことが分かったため、「タイプ5」から「タイプ7」に改める。	—	IEC 62148-12:2022, Fibre optic active components and devices – Package and interface standards – Part 12: Laser transmitters with a coaxial RF connector	IDT	第2条の該当号: 1(種類、寸法、構造) 対象事項: 光伝送用能動部品	法律の目的に適合している。	利点: ア、イ、ウ、オ 欠点: いずれも該当しない。	—	国際規格をJIS化するもの	一般財団法人光産業技術振興協会のWG	2024年4月

産業標準案作成対象テーマ一覧(改正)

認定機関	産業標準作成委員会	制定/改正/廃止	規格番号	JIS案の名称	JIS案の英文名称	改正する理由(必要性)	期待効果	規定項目又は改正点	制定・改正に伴う廃止JIS	対応する国際規格番号及び名称	対応する国際規格との対応の程度	選定基準1 (JIS法第2条の産業標準化の対象)	選定基準2 (JIS法第1条の法律の目的)	選定基準3 (産業標準化の利点・欠点)	選定基準4 (国が主体的に取り組む分野の判断基準)	選定基準5 (市場適合性に関する判断基準)	JIS素案作成委員会(WG)	作成開始予定
JSA	06 電子	改正	C5953-5	光伝送用能動部品—性能標準—第5部:半導体レーザー駆動回路及びクロックデータ再生回路内蔵ATM—PON用光トランシーバ	Fiber optic active components and devices—Performance standards—Part 5 : ATM-PON transceivers with LD driver and CDR Ics	この規格は、電気信号と光信号との相互変換に用いられる光トランシーバの性能標準について規定している。特に、ITU-T Recommendation G.983.1及びIEEE 802.3で通信の仕様が規定されている非同期転送モードパッシブ光ネットワーク(ATM-PON)システムにおいて用いられる光トランシーバを対象としている。この規格の対応国際規格IEC 62149-5の2020年改訂の際、分類の変更のため、箇条4の分類の記載が削除となるなど、現状ATM-PONシステムに用いる光トランシーバの性能標準にかかるIEC規格とJISとの対応関係に不整合が生じており、JISにも技術的内容の変更が必要となっている箇所が生じている。このような状況から、近年の技術の実態に即した内容とするため、このJISを改正する必要がある。	この規格を改正することによって、 a) 製品の効率的な開発・製造が可能となり、かつ、取引の円滑化も期待できる。 b) 製造者や利用者間における製品の相互接続性の確保に寄与することで、市場の拡大が期待できる。	主な改正点は、次のとおり。 a) 分類において、電気インタフェースと光インタフェースとの種類の組合せによって分類できる光トランシーバのタイプについて五つのタイプを例示していたが、対応国際規格の改訂に合わせて光トランシーバのタイプについて定義しているJISを記載するのみとした。 b) 引用規格において、廃止されたJISは削除し、それに代わり制定されたJISを記載した。	—	IEC 62149-5 : 2020, Fibre optic active components and devices – Performance standards – Part 5: ATM-PON transceivers with LD driver and CDR ICs	MOD	第2条の該当号: 1(種類、構造、品質、性能) 対象事項: 光伝送用能動部品	法律の目的に適合している。	利点: ウ、オ 欠点: いずれも該当しない。	—	国際標準をJIS化するもの	一般財団法人光産業技術振興協会のWG	2024年4月
JSA	06 電子	改正	C5954-2	光伝送用能動部品—試験及び測定方法—第2部:ATM—PON用光トランシーバ	Fiber optic active components and devices – Test and measurement procedures – Part 2: ATM-PON transceivers	この規格は、JIS C 5954規格群の一部であり、電気信号と光信号との相互変換に用いられる光トランシーバの光電気特性の試験及び測定手順について規定している。特に、ITU-T Recommendation G.983.1で通信の仕様が規定されている非同期転送モードパッシブ光ネットワーク(ATM-PON)システムで使用する光トランシーバを対象としている。この規格の対応国際規格IEC 62150-2の2010年改訂の際、ネットワーク拡大により光トランシーバの試験をより精緻に実施する必要が生じたため、7.3.3 平均出力の測定方法におけるパワーメータの飽和入力平均出力の2倍以上を必要とする変更があった。このため、現状ATM-PONシステムに用いる光トランシーバの光電気特性の試験及び測定手順にかかるJISとIEC規格との対応関係に不整合が生じている。このような状況から、近年の技術の実態に合わせ、対応国際規格との整合を図るために、このJISを改正する必要がある。	この規格を改正することによって、 a) 製品の効率的な開発・製造が可能となり、かつ、取引の円滑化も期待できる。 b) 製造者や利用者間における製品の相互接続性の確保に寄与することで、市場の拡大が期待できる。	主な改正点は、次のとおり。 ・平均出力の測定方法において、対応国際規格に合わせて、出力光平均パワーを測定する際に使用する光パワーメータの飽和光パワーについて出力光平均パワーの2倍より高いことを必要とする旨の規定を追加する。	—	IEC 62150-2:2010,Fibre optic active components and devices – Test and measurement procedures – Part 2: ATM-PON transceivers	MOD	第2条の該当号: 4(試験方法) 対象事項: 光伝送用能動部品	法律の目的に適合している。	利点: ア、オ 欠点: いずれも該当しない。	—	国際標準をJIS化するもの	一般財団法人光産業技術振興協会のWG	2024年4月

産業標準案作成対象テーマ一覧(改正)

認定機関	産業標準作成委員会	制定/改正/廃止	規格番号	JIS案の名称	JIS案の英文名称	改正する理由(必要性)	期待効果	規定項目又は改正点	制定・改正に伴う廃止JIS	対応する国際規格番号及び名称	対応する国際規格との対応の程度	選定基準1 (JIS法第2条の産業標準化の対象)	選定基準2 (JIS法第1条の法律の目的)	選定基準3 (産業標準化の利点・欠点)	選定基準4 (国が主体的に取り組む分野の判断基準)	選定基準5 (市場適合性に関する判断基準)	JIS素案作成委員会(WG)	作成開始予定
JSA	06 電子	改正	C5965-1	光ファイバ接続デバイス及び光受動部品—シングルモード光ファイバ用光ファイバコネクタ光学互換標準—第1部:1310nmゼロ分散形光ファイバ用光学互換標準の通則(現行名称:光ファイバコネクタ光学互換—第1部:シングルモード(1310nmゼロ分散形)光ファイバ用光学互換標準の通則)	Fiber optic interconnecting devices and passive components—Connector optical interfaces for single-mode fibers—Part 1: Optical interfaces for dispersion unshifted fibers—General and guidance(現行名称:Fiber optic connector optical interfaces—Part 1: Optical interfaces for single mode non-dispersion shifted fibers—General and guidance)	この規格は、シングルモード(1310nmゼロ分散形)光ファイバ用光学互換標準について規定されている。この規格には、この規格群の構成、光学互換標準の等級、光学互換標準で必要な規則、基準点に対する光ファイバコア位置、主要パラメータ及び適切な試験方法が含まれており、2005年に第1版として発行されたIEC 61755-1(以下、対応国際規格という。)を基に技術的内容及び対応国際規格の構成を変更することなく2009年に作成された。その後、近年の光ファイバの技術の進歩、種類の増加により対応国際規格が2022年に第2版として改訂され、引用規格の追加、光学性能に影響を及ぼすキーパラメータにモードフィールド径のミスマッチの追加、多心光ファイバコネクタへの対応、及び文章全体についても見直しが行われている。よって対応国際規格の最新版に合わせたJISに改正することで規格の整合を図る必要がある。	この規格を改正することによって、最新の引用規格、構成等を参照することが可能となり、規格の運用がさらに促進され、取引の円滑化及び取引の合理化・効率化を図ることができる。	主な改正点は、次のとおり、いずれも改訂された対応国際規格との整合を図るためである。 ・表題の変更 ・概要(簡条0.1)国際規格にあるモードフィールド径の幅を追加。信頼性標準から信頼性技術報告へ表現の変更。 ・引用規格(簡条2)反射減衰量、挿入損失の検査及び測定に関する国際規格の追加 ・用語及び定義(簡条3)不要な用語及び定義の削除。 ・構成(簡条4)表1の適用及びパラメータ例の内容を変更。 ・光学互換標準の等級(簡条7)基準点に対する光ファイバコア位置の分類分けを追加。 ・主要パラメータ(簡条8)図2、図3、表4及びそれに係る文言の削除。	—	IEC 61755-1 ED2:2022, Fibre optic interconnecting devices and passive components—Connector optical interfaces for single-mode fibers—Part 1: Optical interfaces for dispersion unshifted fibers—General and guidance	IDT	第2条の該当号: 1(構造、等級、性能) 対象事項: 光ファイバコネクタ	法律の目的に適合している。	利点: ウ、オ 欠点: いずれも該当しない。	—	国際規格をJIS化するもの	一般財団法人光産業技術振興協会のWG	2024年4月
JSA	06 電子	改正	C5965-2-1	光ファイバ接続デバイス及び光受動部品—シングルモード光ファイバ用光ファイバコネクタ光学互換標準—第2-1部:1310nmゼロ分散形直角PC端面光ファイバの接続パラメータ(現行名称:光ファイバコネクタ光学互換—第2-1部:シングルモード直角PC端面光ファイバ光学互換標準の指針)	Fiber optic interconnecting devices and passive components—Connector optical interfaces for single-mode fibers—Part 2-1: Connection parameters of dispersion unshifted physically contacting fibers—Non-angled(現行名称:Fiber optic connector optical interfaces—Part 2-1: Optical interface standard single mode non-angled physically contacting fibers)	この規格は、直角PC(Physical Contact)端面をもつシングルモード光ファイバ同士の接続において、挿入損失及び反射減衰量の要求性能を満足する一連の要件についての指針を示したものである。近年、光ファイバのPC端面の外観検査技術が進歩したことに伴い、端面の欠陥サイズ及びスクラッチ幅並びにそれぞれの数を規定する必要性が生じており、これに対応するために対応国際規格は2022年8月にEd.2として改訂されている。このような状況から国内においても、近年の技術進歩に対応した内容とするともに対応国際規格との乖離を解消するため、外観検査の規定を改めるなど、このJISを改正する必要がある。	国際規格に合わせた改正を行うことによって、光ファイバコネクタ製品の光ファイバ端面の外観品質を国際規格と整合することができ、取引の円滑化及び取引の合理化・効率化が図られるとともに、新企業の参入を容易にするなど市場活性化を促すことが期待できる。	主な改正点は次のとおり。 ・規格名称において、規格の規定内容の変更に対応させ、また、国際規格との整合を図った名称に改める。 ・用語及び定義の簡条を新たに追加し、defect sizeの用語の定義が明確となるよう規定する。 ・反射減衰量の等級及び基準において、反射減衰量等級ごとの外観要求の詳細規定を追加する。 ・反射減衰量の等級及び基準において、加工変質層と反射減衰量との関係についての記載を、参考の附属書として記載する。	—	IEC 61755-2-1:2022, Fibre optic interconnecting devices and passive components—Connector optical interfaces for single-mode fibers—Part 2-1: Connection parameters of dispersion unshifted physically contacting fibers—Non-angled	IDT	第2条の該当号: 1(等級、性能) 対象事項: 光ファイバコネクタ	法律の目的に適合している。	利点: ウ、オ 欠点: いずれも該当しない。	—	国際規格をJIS化するもの	一般財団法人光産業技術振興協会のWG	2024年4月

産業標準案作成対象テーマ一覧(改正)

認定機関	産業標準作成委員会	制定/改正/廃止	規格番号	JIS案の名称	JIS案の英文名称	改正する理由(必要性)	期待効果	規定項目又は改正点	制定・改正に伴う廃止JIS	対応する国際規格番号及び名称	対応する国際規格との対応の程度	選定基準1 (JIS法第2条の産業標準化の対象)	選定基準2 (JIS法第1条の法律の目的)	選定基準3 (産業標準化の利点・欠点)	選定基準4 (国が主体的に取り組む分野の判断基準)	選定基準5 (市場適合性に関する判断基準)	JIS素案作成委員会(WG)	作成開始予定
JSA	06 電子	改正	C5965-2-2	光ファイバ接続デバイス及び光受動部品—シングルモード光ファイバ用光ファイバコネクタ光学互換標準—第2—2部:1310nmゼロ分散形斜めPC端面光ファイバの接続パラメータ (現行名称:光ファイバコネクタ光学互換—第2—2部:シングルモード斜めPC端面光ファイバ光学互換標準の指針)	Fiber optic interconnecting devices and passive components – Connector optical interfaces for single-mode fibers – Part 2-2: Connection parameters of dispersion unshifted physically contacting fibers – Angled (現行名称:Fiber optic connector optical interfaces – Part 2-2: Optical interface standard single mode angled physically contacting fibers)	この規格は、8 度斜め PC(Physical Contact) 端面をもつシングルモード光ファイバ(以下、APC端面光ファイバという。)同士の接続において、挿入損失及び反射減衰量の要求性能を満足する一連の要件についての指針を示したものである。近年、光ファイバのPC端面の外観検査技術が進歩したことに伴い、端面の欠陥サイズ及びスクラッチ幅並びにそれぞれの数量を規定する必要が生じており、これに対応するために対応国際規格は2022年9月にEd.2として改訂されている。このような状況から国内においても、近年の技術進歩に対応した内容とするとともに対応国際規格との乖離を解消するため、外観検査の規定を改めるなど、このJISを改正する必要がある。	国際規格に合わせた改正を行うことにより、光ファイバコネクタ製品の光ファイバ端面の外観品質を国際規格と整合することができ、取引の円滑化及び取引の合理化・効率化が図られるとともに、新企業の参入を容易にするなど市場活性化を促すことが期待できる。	主な改正点は次のとおり。 ・規格名称において、規格の規定内容の変更に対応させ、また、国際規格との整合を図った名称に改める。 ・用語及び定義の簡条を新たに追加し、defect sizeの用語の定義が明確となるよう規定する。 ・反射減衰量の等級及び基準において、反射減衰量等級を満たす外観要求の詳細規定を追加する。 ・反射減衰量の等級及び基準において、端面角度と反射減衰量との関係についての記載を、参考の附属書として記載する。	—	IEC 61755-2-2:2022, Fibre optic interconnecting devices and passive components – Connector optical interfaces for single-mode fibers – Part 2-2: Connection parameters of dispersion unshifted physically contacting fibers – Angled	IDT	第2条の該当号: 1(等級、性能) 対象事項: 光ファイバコネクタ	法律の目的に適合している。	利点: ウ、オ 欠点: いずれも該当しない。	—	国際規格をJIS化するもの	一般財団法人光産業技術振興協会のWG	2024年4月
JSA	06 電子	改正	C6122-3-2	光増幅器—測定方法—第3-2部:雑音指数パラメータ—電気スペクトラムアナライザ試験方法	Optical amplifiers—Test methods—Part 3-2:Noise figure parameters—Electrical spectrum analyzer method	この規格は、現在商用化されている希土類が添加されたアクティブ光ファイバを使用した光ファイバ増幅器(OFA)の雑音指数パラメータによる電気スペクトラムアナライザ試験方法について規定したもので、電気スペクトラムアナライザを用いた光ファイバ増幅器の雑音指数パラメータの測定方法を規定するため、2003年に発行されたIEC 61290-3-2(以降、対応国際規格という。)の第1版を基に、2006年に制定された。その後、対応国際規格は、光ファイバ増幅器以外の半導体光増幅器などにも試験対象を拡張し、さらに最新の技術を反映し、2008年に7月に第2版として改訂された。このような状況から、対応国際規格との乖離を解消するとともに、より広くJISの適用を図るなど技術の実態に即した内容にするため、JISを改正する必要がある。	この改正によって、半導体光増幅器、ラマン増幅を用いた光増幅器及び平面形光導波路増幅器にも本測定方法を適用できるようになり、光ファイバ増幅器以外の光増幅器技術の普及が加速する効果も期待できる。	主な改正点は、次のとおり。 ・適用範囲において、現行規格での光ファイバ増幅器に加えて、昨今の市場での光増幅器の普及状況を踏まえて半導体光増幅器、ラマン増幅を用いた光増幅器及び平面形光導波路増幅器も試験の対象とするなるよう改める。 ・記号及び略語において、附属書の参考として記載しているものを、規格本体に移行して規定する。	—	IEC 61290-3-2:2008, Optical amplifiers – Test methods – Part 3-2: Noise figure parameters – Electrical spectrum analyzer method	IDT	第2条の該当号: 4(測定方法) 対象事項: 電気スペクトラムアナライザ	法律の目的に適合している。	利点: ア、エ、オ、キ 欠点: いずれも該当しない。	—	国際標準をJIS化するもの	一般財団法人光産業技術振興協会のWG	2024年4月

産業標準案作成対象テーマ一覧(改正)

認定機関	産業標準作成委員会	制定/改正/廃止	規格番号	JIS案の名称	JIS案の英文名称	改正する理由(必要性)	期待効果	規定項目又は改正点	制定・改正に伴う廃止JIS	対応する国際規格番号及び名称	対応する国際規格との対応の程度	選定基準1 (JIS法第2条の産業標準化の対象)	選定基準2 (JIS法第1条の法律の目的)	選定基準3 (産業標準化の利点・欠点)	選定基準4 (国が主体的に取り組む分野の判断基準)	選定基準5 (市場適合性に関する判断基準)	JIS素案作成委員会 (WG)	作成開始予定
JSA	06 電子	改正	C6122-4-1	光増幅器-測定方法-第4-1部: 過渡パラメータ二波長法を用いた利得パラメータ測定	Optical amplifiers-Test methods-Part 4-1: Transient parameters-Measurement of gain parameters using two-wavelength method	この規格は、EDFA及び光増幅器(OA)を含む光サブシステム、二波長法による過渡パラメータ測定方法について規定したもので、2011年に第1版として発行されたIEC 61290-4-1(以下、対応国際規格という。)を基に技術的内容及び構成を変更することなく、2013年に制定された。その後、対応国際規格は、2016年に、最新の技術情報を反映し、適用範囲を光増幅器へ拡張し、用語及び定義の一般事項として規定している「過渡応答」などに関して、既存の測定装置の箇条に合体し、手順の箇条、データ分析の箇条、試験結果の箇条を、IEC 61290-4規格群の他のパートの構成に合わせた改訂が行われた。このような状況から、光増幅器の産業分野では、国内でも半導体光増幅器などの市場適用が進んでおり、これらの規格群に基づいた適切な測定を行うため、対応国際規格に合わせたJISの改正が必要である。	このJISの改正によって、海外との商取引の場合の市場の混乱を低減する効果が期待できる。	主な改正点は、次のとおり。 ・用語及び定義において、一般事項として規定している「過渡応答」などに関しては、測定装置の箇条へ移行する。 ・手順において、同じ規格群のJIS C 6122-4-3に合わせて測定準備及び測定条件で構成する規定に改める。 ・測定結果において、同じ規格群のJIS C 6122-4-3に合わせて測定設定及び測定データで構成する規定に改める。	—	IEC 61290-4-1:2016, Optical amplifiers - Test methods - Part 4-1: Gain transient parameters - Two-wavelength method	IDT	第2条の該当号: 4(測定方法) 対象事項: 光増幅器	法律の目的に適合している。	利点: ア、エ、オ、キ 欠点: いずれも該当しない。	—	国際標準をJIS化するもの	一般財団法人光産業技術振興協会のWG	2024年4月
JSA	06 電子	改正	C6122-4-3	光増幅器-測定方法-第4-3部: 過渡パラメータパワー制御単一チャネル光増幅器のパワーパラメータ測定	Optical amplifiers-Test methods-Part 4-3: Power transient parameters-Single channel optical amplifiers in output power control	この規格は、光増幅器の出力光パワーの過渡特性の測定方法について規定したもので、2015年に第1版として発行されたIEC61290-4-3(以下、対応国際規格という。)を基に、2018年に制定された。その後、対応国際規格は、2018年に第2版として改訂され、信号パワーに対する自然放光(ASE)の測定値の定義が、IEC 61290-3-3(Optical amplifiers - Test methods - Part 3-3: Noise figure parameters - Signal power to total ASE power ratio)の定義と整合された。 一方、JISにおいても、IEC 61290-3-3の対応JISであるJIS C 6122-3-3(光増幅器-測定方法-第3-3部: 雑音指数パラメータ-信号対総ASEパワー比)が、日本国内の実態に合わせて当該の定義を改めるため、2016年に改正された。このような状況から、この規格においても、当該測定値の定義を関連JISや対応国際規格に整合させ、使用者に適切な情報を提供するためにJISの改正が必要である。	この改正によって、JISの使用者の混乱を防止し、正確及び高信頼性の測定方法を提供することができることから、円滑な商取引を促進する効果が期待される。	主な改正点は、次のとおり。 ・装置において、パワー過渡測定系の図の、光検出器の前に可変光減衰器(VOA)を追加する。 ・単一波長EDFAにおける出力過渡現象に関する背景の附属書において、自然放光(ASE)の測定値の定義を関連JIS及び対応国際規格と整合させる。	—	IEC 61290-4-3:2018, Optical amplifiers - Test methods - Part 4-3: Power transient parameters - Single channel optical amplifiers in output power control	IDT	第2条の該当号: 4(測定方法) 対象事項: 光増幅器	法律の目的に適合している。	利点: ア、エ、オ、キ 欠点: いずれも該当しない。	—	国際標準をJIS化するもの	一般財団法人光産業技術振興協会のWG	2024年4月

産業標準案作成対象テーマ一覧(改正)

認定機関	産業標準作成委員会	制定/改正/廃止	規格番号	JIS案の名称	JIS案の英文名称	改正する理由(必要性)	期待効果	規定項目又は改正点	制定・改正に伴う廃止JIS	対応する国際規格番号及び名称	対応する国際規格との対応の程度	測定基準1 (JIS法第2条の産業標準化の対象)	測定基準2 (JIS法第1条の法律の目的)	測定基準3 (産業標準化の利点・欠点)	測定基準4 (国が主体的に取り組む分野の判断基準)	測定基準5 (市場適合性に関する判断基準)	JIS素案作成委員会(WG)	作成開始予定
JSA	06 電子	改正	C61300-3-45	光ファイバ接続デバイス及び光受動部品ー基本試験及び測定手順ー第3-45部:検査及び測定ー多心光ファイバコネクタのランダム接続時の挿入損失	Fiber optic interconnecting devices and passive components - Basic test and measurement procedures - Part 3-45: Examinations and measurements - Attenuation of random mated multi-fiber connectors	この規格は、JIS C 5964 規格群で規定する、直角フィジカルコンタクト及び斜めPCの1列多心角形フェルール光ファイバコネクタのランダム接続時の挿入損失の性能パラメータについて規定するもので、損失の統計分布及び平均値を測定するための手順について規定している。 対応国際規格は2023年6月にEd.2として改訂され、最新の技術状況を反映させるため、1列多心光ファイバから1列の文言が削除され、12心を超える光ファイバコネクタ用サンプル数の追加、及びマルチモード測定方法の追加が行われた。このような状況から国内についても、技術の実態に即した内容とするため、また、対応国際規格との乖離を解消するとともに、測定方法の統一を図るために、このJISを改正する必要がある。	最新の技術状況を盛り込んだこの規格を改正することによって、測定及び試験を行う試験条件を正確に引用することができ、規格の運用をさらに促進することができる。	主な改正点は次のとおり。 ・引用規格において、対応国際規格との整合を図るため、IEC 63267の記載を追加する。 ・測定方法の概要において、技術の実態と対応国際規格との整合を図るため、試料数を示した表に12心以上の項目を追加するとともに方法2の試料数の表にアダプタの項目を追加する。 ・測定手順において、対応国際規格との整合を図るため、8心、10心及び12心光コネクタに対する測定方法1並びに測定方法2の図に12心以上の項目を追加する。	—	IEC 61300-3-45,Fibre optic interconnecting devices and passive components - Basic test and measurement procedures - Part 3-45: Examinations and measurements - Attenuation of random mated multi-fibre connectors	IDT	第2条の該当号: 4(試験方法、測定方法) 対象事項: 光ファイバ接続デバイス	法律の目的に適合している。	利点: ウ、オ 欠点: いずれも該当しない。	—	国際規格をJIS化するもの	一般財団法人光産業技術振興協会のWG	2024年4月

産業標準案作成対象テーマ一覧(廃止)

認定機関	産業標準作成委員会	制定／改正／廃止	規格番号	JIS案の名称 (廃止の場合は、現行JISの名称)	JIS案の英文名称 (廃止の場合は、現行JISの英文名称)	廃止する理由	対応する国際規格番号及び名称	対応する国際規格との対応の程度	JIS素案作成委員会(WG)	作成開始予定
JSA	06 電子	廃止	C5940	光伝送用半導体レーザ通則	General rules of laser diodes for fiber optic transmission	この規格は、光源として使用する光伝送用半導体レーザ（電子回路内蔵形を除く。）の用語、分類、最大定格、性能などの一般的共通事項について規定するものである。対応国際規格は、IEC 60747-5（Semiconductor devices, Discrete devices and integrated circuits - Part 5: Optoelectronic devices：1992年制定、1995年修正2版発行）である。なお、IEC 60747-5の一部として含まれていた半導体レーザについては、2006年にIEC 60747-5-4（Semiconductor devices - Part 5-4: Optoelectronic devices - Semiconductor lasers：2006年制定、2022年改訂）に移行している。また、JIS C 5940に関連するJISとしてJIS C 5944（光伝送用半導体レーザモジュール通則）が制定されており、対応国際規格はIEC 62007-1（Semiconductor optoelectronic devices for fibre optic system applications - Part 1: Specification template for essential ratings and characteristics：1997年制定、2015年改訂）である。 JIS C 5940（JIS C 5944も同様）では定格及び性能に加え環境試験及び耐久性試験についても項目が規定されており、さらに規定値として記述すべき数値の範囲や性能の試験条件として与えるべき数値の範囲が規定されている（JIS C 5944では数値は推奨値となっている）。しかし、IEC 60747-5-4ではJISとは異なり、定格及び性能について規定すべき事項については規定せず、環境試験及び耐久性試験については規定が無い（IEC 62007-1も同様）。これは光伝送用部品に関するIEC規格が、個々に規定すべき性能は応用により異なることから部品ごとの性能標準テンプレートは最小限の共通事項のみを規定する、及び環境試験及び耐久性試験も応用ごとに異なるので個々の応用ごとに対応した性能標準テンプレート又は性能標準で規定するという体系に変わってきたことによるものである。このようにIEC規格とJISとの対応関係に不整合が生じているので、混乱を避けるために新たにIEC規格と整合したJISの制定が必要である。そのため、半導体レーザと半導体レーザモジュールは共通事項が多いことから、JIS C 5940と関連したJIS C 5944の両JISの内容を包含した1つの規格とすることで規格利用者の利便性向上を図り、IEC規格と整合した性能標準テンプレートとすることしJIS C 5955規格群（性能標準テンプレート）における新たな規格（JIS C 5955-4）を制定する。これに伴い重複するJIS C 5940を廃止する。	IEC 60747-5:1992 Semiconductor devices - Discrete devices and integrated circuits - Part 5: Optoelectronic devices, IEC 60747-5:1992/AMENDMENT 1:1994 Amendment 1 - Semiconductor devices - Discrete devices and integrated circuits - Part 5: Optoelectronic devices, IEC 60747-5:1992/AMENDMENT 2:1995 Amendment 2 - Semiconductor devices - Discrete devices and integrated circuits - Part 5: Optoelectronic devices	MOD	一般財団法人光産業技術振興協会のWG	2024年4月
JSA	06 電子	廃止	C5941	光伝送用半導体レーザ測定方法	Measuring methods of laser diodes for fiber optic transmission	この規格は、光源として使用する光伝送用半導体レーザ（電子回路内蔵型を除く。ただし、必要に応じモニタ用フォトダイオードを含む。）の測定方法を規定しているものである。この規格の対応国際規格はIEC 60747-5:1992（Semiconductor devices, Discrete devices and integrated circuits - Part 5: Optoelectronic devices）であるが、この中にあった半導体レーザの測定方法については、基本特性測定方法についてはIEC 60747-5-4（Semiconductor devices - Part 5-4: Optoelectronic devices - Semiconductor lasers 2006年制定 2022年改訂）に、光伝送用に特化した測定方法は光伝送用半導体部品の測定方法を集めたIEC 62007-2（Semiconductor optoelectronic devices for fibre optic system applications - Part 2: Measuring methods 1997年制定 2009年改訂）に包含された。IEC 62007-2では光伝送用半導体レーザ、光伝送用半導体レーザモジュール、光伝送用発光ダイオード及び光伝送用フォトダイオードを、発光デバイスと受光デバイスという分類で纏めて規定している。IEC 62007-2制定の際に半導体レーザの基本特性測定方法はIEC 60747-5に残され、2006年にIEC 60747-5-4に置き換えられた。このため、IEC規格ではIEC 60747-5-4に規定されている基本特性測定方法とIEC 62007-2に規定されている測定方法を共に参照する必要がある。 また、JISにおける光伝送用半導体部品の測定方法は、JIS C 5941（光伝送用半導体レーザ測定方法）に加え、JIS C 5945（光伝送用半導体レーザモジュール測定方法）、JIS C 5951（光伝送用発光ダイオード測定方法）及びJIS C 5991（光伝送用フォトダイオード測定方法）がIEC 60747-5に対応している。 このようにIEC規格とJISとの対応関係に不整合が生じていることから、規格利用者の混乱を避けるとともに1つのJISとすることで利便性を向上させるため、現行規格JIS C 5941、JIS C 5945、JIS C 5951及びJIS C 5991を包含し、現行IEC規格と整合した測定方法を新たにJIS C 5954-8として制定する。これに伴い重複するJIS C 5941は廃止とする。	IEC 60747-5:1992 Semiconductor devices - Discrete devices and integrated circuits - Part 5: Optoelectronic devices, IEC 60747-5:1992/AMENDMENT 1:1994 Amendment 1 - Semiconductor devices - Discrete devices and integrated circuits - Part 5: Optoelectronic devices, IEC 60747-5:1992/AMENDMENT 2:1995 Amendment 2 - Semiconductor devices - Discrete devices and integrated circuits - Part 5: Optoelectronic devices	MOD	一般財団法人光産業技術振興協会のWG	2024年4月
JSA	06 電子	廃止	C5944	光伝送用半導体レーザモジュール通則	General rules of laser diode modules for fiber optic transmission	この規格は、光源として使用する光伝送用半導体レーザモジュールの用語、最大定格、性能などの一般的共通事項について規定したものである。対応国際規格は、IEC 62007-1（Semiconductor optoelectronic devices for fibre optic system applications - Part 1: Specification template for essential ratings and characteristics：1997年制定、2015年改訂）である。JIS C 5944に関連するJISとしてJIS C 5940（光伝送用半導体レーザ通則）が制定されており、対応国際規格は、IEC 60747-5（Semiconductor devices, Discrete devices and integrated circuits - Part 5: Optoelectronic devices：1992年制定、1995年修正2版発行）である。なお、IEC 60747-5の一部として含まれていた半導体レーザについては、2006年にIEC 60747-5-4（Semiconductor devices - Part 5-4: Optoelectronic devices - Semiconductor lasers：2006年制定、2022年改訂）に移行している。 JIS C 5944（JIS C 5940も同様）では定格及び性能に加え環境試験及び耐久性試験についても項目が規定されており、さらに規定値として記述すべき数値の範囲や性能の試験条件として与えるべき数値の範囲が推奨値として示されている（JIS C 5940では示されている数値の範囲となっている）。しかし、IEC 62007-1ではJISとは異なり、定格及び性能について規定すべき事項だけを規定し個々の数値については規定せず、環境試験及び耐久性試験については規定が無い（IEC 60747-5-4も同様）。これは光伝送用部品に関するIEC規格が、個々に規定すべき性能は応用により異なることから部品ごとの性能標準テンプレートは最小限の共通事項のみを規定する、及び環境試験及び耐久性試験も応用ごとに異なるので個々の応用ごとに対応した性能標準テンプレート又は性能標準で規定するという体系に変わってきたことによるものである。 このようにIEC規格とJISとの対応関係に不整合が生じているので、混乱を避けるために新たにIEC規格と整合したJISの制定が必要である。そのため、半導体レーザモジュールと半導体レーザは共通事項が多いことから、JIS C 5944と関連したJIS C 5940の両JISの内容を包含した1つの規格とすることで規格利用者の利便性向上を図り、IEC規格と整合した性能標準テンプレートとすることしJIS C 5955規格群（性能標準テンプレート）における新たな規格（JIS C 5955-4）を制定する。これに伴い重複するJIS C 5944を廃止する。	IEC 62007-1:1999 Semiconductor optoelectronic devices for fibre optic system applications - Part 1: Specification template for essential ratings and characteristics	MOD	一般財団法人光産業技術振興協会のWG	2024年4月

JSA	06 電子	廃止	C5945	光伝送用半導体レーザモジュール測定方法	Measuring methods of laser diode modules for fiber optic transmission	この規格は、光源として使用する光伝送用半導体レーザモジュール（光ファイバビグデル又は光ファイバ接続用のレセプタクルをもち、必要に応じてフォトダイオード、電子冷却素子、温度センサ、光アイソレータなどの積層素子を内蔵するものである。）の測定方法を規定している。この規格の対応国際規格IEC 62007-2（Semiconductor optoelectronic devices for fibre optic system applications - Part 2: Measuring methods）はIEC 60747-5:1992（Semiconductor devices, Discrete devices and integrated circuits - Part 5: Optoelectronic devices）の中で光伝送用に特化した測定方法を抽出して規定したもので1997年に制定され、光伝送用半導体レーザモジュール以外に、光伝送用半導体レーザ、光伝送用発光ダイオード及び光伝送用フォトダイオードを、発光デバイスと受光デバイスという分類で纏めて記載している。半導体レーザ及び半導体レーザモジュールの基本特性測定方法はIEC 62007-2制定の際にIEC 60747-5に残され、2006年にIEC 60747-5-4（Semiconductor devices - Part 4: Optoelectronic devices - Semiconductor lasers）に置き換えられた。このため、IEC規格ではIEC 60747-5-4に規定されている基本特性測定方法とIEC 62007-2に規定されている測定方法を共に参照する必要がある。 また、JISにおける光伝送用半導体部品の測定方法は、JIS C 5945（光伝送用半導体レーザモジュール測定方法）に加え、JIS C 5941（光伝送用半導体レーザ測定方法）、JIS C 5951（光伝送用発光ダイオード測定方法）及びJIS C 5991（光伝送用フォトダイオード測定方法）がIEC 60747-5に対応している。 このようにIEC規格とJISとの対応関係に不整合が生じていることから、規格利用者の混乱を避けるとともに1つのJISとすることで利便性を向上させるため、現行規格JIS C 5945、JIS C 5941、JIS C 5951及びJIS C 5991を包含し、現行IEC規格と整合した測定方法を新たにJIS C 5954-8として制定する。これに伴い重複するJIS C 5945は廃止とする。	IEC 62007-2:1996 Semiconductor optoelectronic devices for fibre optic system applications - Part 2: Measuring methods	MOD	一般財団法人光産業技術振興協会のWG	2024年4月
JSA	06 電子	廃止	C5950	光伝送用発光ダイオード通則	General rules of light emitting diodes for fiber optic transmission	この規格は、光源として使用する光伝送用発光ダイオード（電子回路内蔵形を除く。）の用語、記号、分類、最大定格、性能などの一般的共通事項について規定したものである。この規格の対応国際規格はIEC 60747-5:1992+AMD1:1994（Semiconductor devices, Discrete devices and integrated circuits - Part 5: Optoelectronic devices）であるが、IEC 60747-5の一部として含まれていた光伝送用発光ダイオードは1997年に他の光伝送用半導体部品とともに光伝送用半導体部品に特化したIEC 62007-1（Semiconductor optoelectronic devices for fibre optic system applications - Part 1: Specification template for essential ratings and characteristics）に定格及び性能が包含された。 JIS C 5950では定格及び性能に加え環境試験及び耐久性試験についても項目が規定されており、さらに規定値として記述すべき数値の範囲や性能の試験条件として与えるべき数値の範囲が規定されている。一方、IEC 62007-1では、JIS C 5950とは異なり、光伝送用発光ダイオードの定格と性能について規定すべき事項だけを規定し、個々の数値については規定せず、環境試験及び耐久性試験については規定が無い。これは光伝送用部品に関するIEC規格が、個々に規定すべき性能は応用により異なることから部品ごとの性能標準テンプレートは最小限の共通事項のみを規定する、及び環境試験及び耐久性試験も応用ごとに異なるので個々の応用ごとに対応した性能標準テンプレート又は性能標準で規定するという体系に変わってきたことによるものである。 このようにIEC規格とJISとの対応関係に不整合が生じているので、混乱を避けるために新たにIEC規格と整合したJISの制定が必要である。そのため、IEC規格と整合した性能標準テンプレートとすることしJIS C 5955規格群（性能標準テンプレート）における新たな規格（JIS C 5955-5）を制定する。これに伴い重複するJIS C 5950を廃止する。	IEC 60747-1:1983 Semiconductor devices - Discrete devices - Part 1: General IEC 60747-1:1983/AMENDMENT 1:1991 Amendment 1 - Semiconductor devices - Discrete devices and integrated circuits - Part 1: General, IEC 60747-5:1992 Semiconductor devices - Discrete devices and integrated circuits - Part 5: Optoelectronic devices, IEC 60747-5:1992/AMENDMENT 1:1994 Amendment 1 - Semiconductor devices - Discrete devices and integrated circuits - Part 5: Optoelectronic devices	MOD	一般財団法人光産業技術振興協会のWG	2024年4月
JSA	06 電子	廃止	C5951	光伝送用発光ダイオード測定方法	Measuring methods of light emitting diodes for fiber optic transmission	この規格は、光源として使用する光伝送用発光ダイオード（電子回路内蔵形を除く。）の測定方法を規定している。この規格の対応国際規格はIEC 60747-5:1992（Semiconductor devices, Discrete devices and integrated circuits - Part 5: Optoelectronic devices）であるが、この中にあった光伝送用発光ダイオードの測定方法について、基本特性測定方法はIEC 60747-5-6（Semiconductor devices - Part 5-6: Optoelectronic devices - Light emitting diodes 2016年制定 2021年改訂）に、光伝送用に特化した測定方法は光伝送用半導体部品の測定方法を集めたIEC 62007-2（Semiconductor optoelectronic devices for fibre optic system applications - Part 2: Measuring methods 1997年制定 2009年改訂）に包含された。IEC 62007-2では、光伝送用発光ダイオード以外に、光伝送用半導体レーザ、光伝送用半導体レーザモジュール及び光伝送用フォトダイオードを、発光デバイスと受光デバイスという分類で纏めて規定している。IEC 62007-2制定の際に発光ダイオードの基本特性測定方法はIEC 60747-5に残され、2016年にIEC 60747-5-6に置き換えられた。このため、IEC規格ではIEC 60747-5-6に規定されている基本特性測定方法とIEC 62007-2に規定されている測定方法を共に参照する必要がある。 また、JISにおける光伝送用半導体部品の測定方法は、JIS C 5951（光伝送用発光ダイオード測定方法）に加え、JIS C 5941（光伝送用半導体レーザ測定方法）、JIS C 5945（光伝送用半導体レーザモジュール測定方法）及びJIS C 5991（光伝送用フォトダイオード測定方法）がIEC 60747-5に対応している。 このようにIEC規格とJISとの対応関係に不整合が生じていることから、規格利用者の混乱を避けるとともに1つのJISとすることで利便性を向上させるため、現行規格JIS C 5941、JIS C 5945、JIS C 5951及びJIS C 5991を包含し、現行IEC規格と整合した測定方法を新たにJIS C 5954-8として制定する。これに伴い重複するJIS C 5951は廃止とする。	IEC 60747-5:1992 Semiconductor devices - Discrete devices and integrated circuits - Part 5: Optoelectronic devices, IEC 60747-5:1992/AMENDMENT 1:1994 Amendment 1 - Semiconductor devices - Discrete devices and integrated circuits - Part 5: Optoelectronic devices	MOD	一般財団法人光産業技術振興協会のWG	2024年4月
JSA	06 電子	廃止	C5990	光伝送用フォトダイオード通則	General rules of photodiodes for fiber optic transmission	この規格は、光伝送用フォトダイオード（電子回路内蔵形を除く。）の用語、記号、分類、最大定格、性能などの一般的共通事項について規定したものである。この規格の対応国際規格は、IEC 60747-5:1992+AMD1:1994（Semiconductor devices, Discrete devices and integrated circuits - Part 5: Optoelectronic devices）であるが、1997年にIEC 60747-5の一部として含まれていた光伝送用フォトダイオードは他の光伝送用半導体部品とともに光伝送用半導体部品に特化したIEC 62007-1（Semiconductor optoelectronic devices for fibre optic system applications - Part 1: Specification template for essential ratings and characteristics）に定格と性能が包含された。 JIS C 5990では定格及び性能に加え環境試験及び耐久性試験についても項目が規定されており、さらに規定値として記述すべき数値の範囲や性能の試験条件として与えるべき数値の範囲が推奨値として示されている。しかし、IEC 62007-1では、JIS C 5990とは異なり、光伝送用フォトダイオードの定格と性能について規定すべき事項だけを規定し、個々の数値については規定せず、環境試験及び耐久性試験については規定が無い。これは光伝送用部品に関するIEC規格が、個々に規定すべき性能は応用により異なることから部品ごとの性能標準テンプレートは最小限の共通事項のみを規定する、及び環境試験及び耐久性試験も応用ごとに異なるので個々の応用ごとに対応した性能標準テンプレート又は性能標準で規定するという体系に変わってきたことによるものである。 このようにIEC規格とJISとの対応関係に不整合が生じているので、混乱を避けるために新たにIEC規格と整合したJISの制定が必要である。そのため、IEC規格と整合した性能標準テンプレートとすることしJIS C 5955規格群（性能標準テンプレート）における新たな規格（JIS C 5955-6）を制定する。これに伴い重複するJIS C 5990を廃止する。	IEC 60747-5:1992 Semiconductor devices - Discrete devices and integrated circuits - Part 5: Optoelectronic devices, IEC 60747-5:1992/AMENDMENT 1:1994 Amendment 1 - Semiconductor devices - Discrete devices and integrated circuits - Part 5: Optoelectronic devices	MOD	一般財団法人光産業技術振興協会のWG	2024年4月

JSA	06 電子	廃止	C5991	光伝送用フォトダイオード測定方法	Measuring methods of photodiodes for fiber optic transmission	<p>この規格は、光伝送用フォトダイオード（電子回路内蔵形を除く。）の測定方法について規定している。この規格の対応国際規格 IEC 60747-5:1992 (Semiconductor devices, Discrete devices and integrated circuits - Part 5: Optoelectronic devices) であるが、この中にあった光伝送用フォトダイオードの測定方法について、基本特性測定方法は IEC 60747-5-7 (Semiconductor devices - Part 5-7: Optoelectronic devices - Photodiodes and phototransistors 2016年制定) に、光伝送用に特化した測定方法は光伝送用半導体部品の測定方法を集めた IEC 62007-2 (Semiconductor optoelectronic devices for fibre optic system applications - Part 2: Measuring methods 1997年制定 2009年改訂) に包含された。IEC 62007-2では、光伝送用フォトダイオード以外に光伝送用半導体レーザ、光伝送用半導体レーザモジュール及び光伝送用発光ダイオードを、発光デバイスと受光デバイスという分類で纏めて記載している。IEC 62007-2制定の際に光伝送用フォトダイオードの基本特性測定方法は IEC 60747-5に残され、2006年に IEC 60747-5は IEC 60747-5-6に置き換えられた。このため、IEC規格では IEC 60747-5-7に規定されている基本特性測定方法と IEC 62007-2に規定されている測定方法を共に参照する必要がある。</p> <p>また、JISにおける光伝送用半導体部品の測定方法は、JIS C 5991 (光伝送用フォトダイオード測定方法) に加え、JIS C 5941 (光伝送用半導体レーザ測定方法)、JIS C 5945 (光伝送用半導体レーザモジュール測定方法)、及び JIS C 5951 (光伝送用発光ダイオード測定方法) が IEC 60747-5に対応している。</p> <p>このように IEC規格と JISとの対応関係に不整合が生じており、規格利用者の混乱を避けるとともに1つの規格とすることで利便性を向上させるため、現行規格 JIS C 5941、JIS C 5945、JIS C 5951及び JIS C 5991を包含し、現行 IEC規格と整合した測定方法を新たに JIS C 5954-8として制定する。これに伴い重複する JIS C 5991は廃止とする。</p>	IEC 60747-5:1992 Semiconductor devices - Discrete devices and integrated circuits - Part 5: Optoelectronic devices. IEC 60747-5:1992/AMENDMENT 1:1994 Amendment 1 - Semiconductor devices - Discrete devices and integrated circuits - Part 5: Optoelectronic devices	MOD	一般財団法人光産業技術振興協会の WG	2024年4月
-----	-------	----	-------	------------------	---	---	---	-----	---------------------	---------